※課題番号 : F-12-NM-0053

\*\*支援課題名(日本語): 赤外線受信素子の高感度構造の作製

\*\*Program Title (in English) : Formation of high-sensitive structure for infrared receiving devices

\*\*利用者名(日本語) : 伊藤 忠

\*\*Username(in English) : Tadashi Ito

※所属名(日本語):株式会社豊田中央研究所

\*\*Affiliation (in English) : TOYOTA CENTRAL R&D LABS., INC.

## <u>\*\*概要(Summary)</u>:

アンテナと整流器とを結合した構造の赤外線受信素子は高感度・小型素子として期待される<sup>1)</sup>。整流器は高速動作が必要なため、MIM ダイオードとし、寸法として数 100 nm の微細加工が必要となる。本課題では、電子線描画によるナノ加工と原子層層堆積(ALD)法による絶縁膜形成によって、赤外線素子として高感度が期待できる MIM 構造を作製した。

## \*\*実験(Experimental):

【利用した主な装置】

- 電子線描画装置
- · 原子層堆積装置
- 蒸着装置

### 【実験方法】

酸化膜が形成された Si 基板上の 1 対の Au パッド電極の一方に接触するように Ni のアンテナと伝送線路を電子線描画とリフトオフ法で形成した。次に,原子層堆積(ALD)法で  $Al_2O_3$  膜を形成した。最後に,他方の Au パッド電極に接触するように Al または Ni のアンテナと伝送線路を電子線描画とリフトオフで形成した。このとき,両者の金属パターンが  $Al_2O_3$  層をはさんで一辺 300 nm の正方形で重なるようにし,この部分を MIM ダイオードとした。図 1 は赤外線素子の走査電子顕微鏡(SEM)写真である。

電流電圧曲線の2階微分 d<sup>2</sup>**I**/d **V**<sup>2</sup>の最大値が赤外線 感度に比例 <sup>2)</sup>することを利用して感度を推定した。

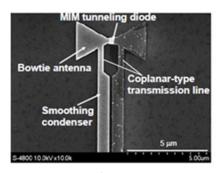


図1. 試作した赤外線受信素子の SEM 写真

## <u>\*\*結果と考察(Results and Discussion)</u>:

1層目の Ni 層の厚さと ALD の堆積回数を最適化し、かつ 2層目の金属を Ni とすることにより、図 2に示すように、 $d^2I/dV^2=1.8 \text{ mA/V}^2$ が得られた。この値は世界トップレベルの値である  $^{1)}$ 。 得られた  $d^2I/dV^2$  の値から推定される赤外線受信素子の感度は 54 mA/W である。

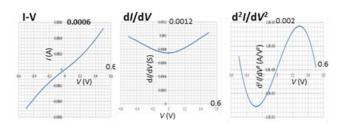


図2. MIM ダイオードの電流電圧曲線

# \*\*その他・特記事項 (Others):

今後,ノイズの少ない赤外線応答測定系を構築し、今 回推定された感度を実証してゆきたい。

#### 参考文献

1) J. A. Bean *et al.*, IEEE J. Quantum Elect., 47 (2011) 126.

2) A. Sanchez *et al.*, J. Appl. Phys. 49 (1978) 5270. 用語説明

MIM ダイオード: 金属/絶縁膜/金属 (metal-insulator-metal) 構造のトンネルダイオード。

## 共同研究者等(Coauthor):

宮崎毅(豊田合成株式会社)

黒崎潤一郎 (豊田合成株式会社)

竹田康彦 (株式会社豊田中央研究所)

## 論文・学会発表 (Publication/Presentation):

T. Ito, J. Kurosaki, T. Miyazaki, D. Tsuya, H. T. Miyazaki, N. Ikeda, Y. Sugimoto, Y. Takeda and T. Motohiro, "Antenna-Coupled Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Ni Tunneling Diodes for Infrared Detection," *IUMRS-Int. Conf. Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2012)*, 23-28 Sept., 2012.